# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-97778

(43)公開日 平成8年(1996)4月12日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 4 B 10/105 10/10 10/22

H04B 9/00

R

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 13 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号

(22)出願日

特願平6-251660

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

平成6年(1994)9月21日

(72)発明者 平島 明 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

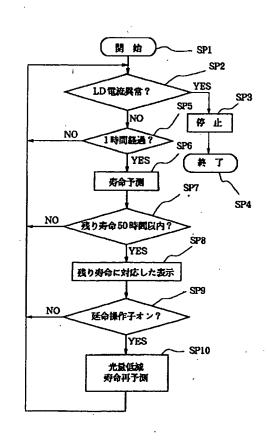
一株式会社内

# (54) 【発明の名称】 光通信装置

### (57)【要約】

【目的】例えば空間を伝播する光ビームを介して伝送対象との間で情報信号を送受する光空間伝送装置等の光通信装置において、使用条件、装置間で大きく変化するレーザーダイオードの寿命を正確に予測する。

【構成】本発明は、レーザーダイオードの特性データを 記憶手段に記憶し、この特性データとレーザーダイオー ドのモニタ結果に基づいて、レーザーダイードの特性が 規定の特性にまで劣化する時間等を予測する。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】レーザーダイオードから射出されるレーザ ーピームを伝送対象に送出し、前記レーザービームを介 して前記伝送対象に所望の情報信号を伝送する光通信装 置において、

前記レーザーダイオードの特性データを記録する記憶手 段と、

前記レーザーダイオードの動作状態をモニタし、モニタ 結果を出力するモニタ手段と、

前記特性データ及びモニタ結果に基づいて、前記レーザ ーダイオードの特性が規定の特性にまで劣化する時間を 予測し、又は前記レーザーダイオードの特性の劣化状況 を予測する演算処理手段とを具えることを特徴とする光 通信装置。

【請求項2】前記特性データは、前記レーザーダイオー ドの発振開始電流の温度特性、前記レーザーダイオード の微分効率の温度特性でなり、

前記モニタ結果は、前記レーザーダイオードの動作電 流、前記レーザーダイオードの温度、前記レーザーダイ オードの動作時間及び前記レーザービームの光量でなる 20 ことを特徴とする請求項1に記載の光通信装置。

【請求項3】前記予測した劣化する時間、又は前記劣化 状況を表示することを特徴とする請求項1又は請求項2 に記載の光通信装置。

【請求項4】前記モニタ結果に基づいて、前記レーザー ダイオードの動作の異常を検出することを特徴とする請 求項1、請求項2又は請求項3に記載の光通信装置。

【請求項5】前記予測した時間に基づいて、前記レーザ ーダイオードの特性が規定の特性にまで劣化する時間 が、前記予測した時間より長くなるように、前記レーザ ービームの光量を低減することを特徴とする請求項1、 請求項2、請求項3又は請求項4に記載の光通信装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光通信装置に関し、例 えば空間を伝播する光ビームを介して伝送対象との間で 情報信号を送受する光空間伝送装置に適用することがで きる。

## [0002]

【従来の技術】従来、この種の光空間伝送装置は、空間 を伝播するレーザービームを介して所望の情報信号を伝 送することにより、簡易に設置してテレビジョン中継等 に使用できるようになされている。

【0003】すなわちこの光空間伝送装置を用いた光通 信システムは、例えばケーブルを簡易に敷設することが 困難な地点間において、互いが対向するように1組の光 空間伝送装置を配置し、これらの光空間伝送装置間で相 互にレーザービームを送受する。ここでこのレーザービ ームは、テレビジョンカメラ等から出力される映像信号 によってレーザーダイオードを駆動して形成される。

【0004】これにより光空間伝送装置では、このレー ザービームを受光して伝送対象から送出された映像信号 等を受信できるようになされている。

2

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】ところでこのように空 間を伝播するレーザービームを介して伝送対象との間で 情報信号を送受する場合において、受信側で大きなダイ ナミックレンジを確保するためには、受信側において充 分な入射光量を確保する必要がある。このため光空間伝 10 送装置では、大出力のレーザーダイオードを用いて、充 分な光量でレーザービームを送出するようになされてい

【0006】ところがこのような大出力のレーザーダイ オードは、長時間使用すると、徐々に劣化し、ついには 安定な通話を確保できなくなる。従って光空間伝送装置 では、レーザーダイオードが寿命に近づくと、レーザー ダイオードを交換する必要がある。

【0007】ところがこの種のレーザーダイオードは、 使用条件、個体間のばらつきにより、寿命が大きく異な る。すなわち図9に示すように、レーザーダイオード は、周囲温度が低い場合は平均寿命時間が長く、また光 量を低減すれば、その分平均寿命時間が長くなる。さら に図10及び図11に示すように、レーザーダイオード の動作特性を表す発振開始電流及び微分効率もパッケー ジ温度に応じて変化し、このことからも特性劣化の程度 が周囲温度に応じて変化することがわかる。

【0008】さらに図12~図14に示すように、レー ザーダイオードを80個サンプリングして測定した結果 によれば、発振開始電流、動作電流、微分効率の何れも 30 が、個体間でばらついていることがわかる。

【0009】これに加えて図15に示すように、このレ ーザーダイオードと同一のパッケージに収納された光量 モニタ用のフォトディテクタにおいても、個体間でばら つきが大きいことがわかる。またこのフォトディテクタ と異なるフォトディテクタを測定した結果によれば、図 16に示すように、この種のフォトディテクタは、温度 によって特性が変化する。

【0010】これにより自動光量制御回路において、フ ォトディテクタの光量検出結果が一定値になるようにレ **40 ーザーダイオードを駆動した場合でも、レーザーダイオ** ードから射出されるレーザービームの光量は、必ずしも 一定値に保持されていないことがわかる。従ってレーザ ーダイオードは、モニタ用フォトディテクタのばらつき によっても駆動条件が変化し、これによっても寿命時間 が大きく異なることがわかる。

【0011】特に光空間伝送装置は、屋内、屋外等、種 々の箇所に設置して使用されることにより、広範囲の周 囲温度で使用され(-20度~50度の範囲)、これに より素子間のばらつきだけでなく、装置の使用条件によ 50 ってレーザーダイオードの寿命が大きく変化する。

【0012】このため光空間伝送装置は、結局、安定し た通話を維持するために、寿命時間までに充分な余裕が ある場合でも、レーザーダイオードを交換しなげればな らない無駄があった。このように使用条件、装置間で大 きく変化するレーザーダイオードの寿命を予測すること ができれば、安定した通話を維持しつつ、この種の無駄 を省くことができ、また必要に応じて駆動条件を変更し て寿命を延ばすこともできる。

【0013】本発明は以上の点を考慮してなされたもの で、使用条件、装置間で大きく変化するレーザーダイオ ードの寿命を正確に予測することができる光通信装置を 提案しようとするものである。

#### [0014]

【課題を解決するための手段】以下の説明は、光通信装 置でなる図2に示した光空間伝送装置の構成図による。 すなわちかかる課題を解決するため本発明においては、 レーザーダイオード4から射出されるレーザービームし 1を伝送対象に送出し、レーザービームし1を介して伝 送対象に所望の情報信号S1を伝送する光通信装置1に おいて、レーザーダイオード4の特性データを記録する 記憶手段26と、レーザーダイオード4の動作状態をモ ニタし、モニタ結果V2、V3、V4を出力するモニタ 手段21、22、23、66と、特性データ及びモニタ 結果V2、V3、V4に基づいて、レーザーダイオード 4の特性が規定の特性にまで劣化する時間を予測し、又 はレーザーダイオード4の特性の劣化状況を予測する演 算処理手段24とを具えるようにする。

【0015】特に、これらの特性データは、レーザーダ イオード4の発振開始電流の温度特性、レーザーダイオ ード4の微分効率の温度特性でなり、モニタ結果は、レ *30* ーザーダイオード4の動作電流、レーザーダイオード4 の温度、レーザーダイオード4の動作時間及びレーザー ビームL1の光量でなるようにする。

【0016】さらに、この予測した劣化する時間、又は レーザーダイオード4の特性の劣化状況を表示する。

【0017】また、モニタ結果V3、V4に基づいて、 レーザーダイオード4の動作の異常を検出する。

【0018】さらに、予測した時間に基づいて、レーザ ーダイオード4の特性が規定の特性にまで劣化する時間 が、予測した時間より長くなるように、レーザーピーム 40 て伝送対象に射出する。これにより光空間伝送装置 1 L1の光量を低減する。

## [0019]

【作用】レーザーダイオード4の特性データを記憶手段 26に記憶し、この特性データとレーザーダイオード4 のモニタ結果V2、V3、V4に基づいて、レーザーダ イオード4の特性が規定の特性にまで劣化する時間、又 はレーザーダイオード4の特性の劣化状況を予測すれ ば、使用条件、装置間で大きく変化するレーザーダイオ ードの寿命を正確に予測することができる。

【0020】特に、これらの特性データとして、レーザ 50 L2とについて、大口径レンズ9、凹レンズ8の光学系

ーダイオード4の発振開始電流の温度特性、レーザーダ イオード4の微分効率の温度特性を記録し、レーザーダ イオード4の動作電流、レーザーダイオード4の温度」 レーザーダイオード4の動作時間及びレーザービームの 光量をモニタして、正確に寿命を予測することができ る。

【0021】また予測結果を表示して、オペレータに注 意を喚起することができる。

【0022】モニタ結果V3に基づいて、レーザーダイ 10 オード4の動作の異常を検出して、レーザーダイオード 4の事故を有効に回避することができる。

【0023】さらに、レーザーダイオード4の特性が規 定の特性にまで劣化する時間が長くなるように、レーザ ーピームL1の光量を低減して、レーザーダイオード4 の寿命を延長することができる。

#### [0024]

【実施例】以下、本発明の一実施例を図面に基づいて詳 述する。

【0025】図2において、1は全体として光空間伝送 装置を示し、同一構成の伝送対象に向けてレーザービー ムL1を射出すると共に、この伝送対象から到来するレ ーザーピームL2を受光し、これにより映像信号等を双 方向で送受する。

【0026】すなわち光空間伝送装置1は、伝送に供す る映像信号等の情報信号S1を信号処理回路2に入力 し、ここで周波数変調した後、周波数多重化する。これ により光空間伝送装置1は、周波数多重化した周波数変 調信号を用いて駆動回路3でレーザーダイオード4を駆

【0027】ここでこのレーザーダイオード4は、光学 部品と共に、鏡筒5に一体に収納されて保持され、直線 偏波のレーザービームL1を凸レンズ6に射出する。こ の凸レンズ6は、このレーザービームL1を平行光線に 変換して偏向ビームスプリッタ7に出力し、偏向ビーム スプリッタ7は、このレーザービームL1を反射して凹 レンズ8に射出する。

【0028】凹レンズ8は、このレーザービームL1を 発散光に変換して大口径レンズ9に射出し、大口径レン ズ9は、このレーザーピームL1を略平行光線に変換し は、このレーザービームL1を介して伝送対象に映像信 号等を送出するようになされている。

【0029】このレーザーピームし1を射出するにつ き、光空間伝送装置1は、レーザーダイオード4を傾け て保持し、これにより大口径レンズ9の前方から光空間 伝送装置1を見たとき、鉛直方向に対してレーザービー ムレ1の偏波面が45度傾くようになされている。これ により光空間伝送装置1では、伝送対象に送出するレー ザービームL1と伝送対象から到来するレーザービーム

を共通に使用してレーザーピームし1及びし2を送受 し、このレーザービームし1及びし2を偏向ビームスプ リッタ7で簡易に分離できるようになされている。

【0030】すなわち光空間伝送装置1において、大口 径レンズ9は、伝送対象から到来するレーザーピームし 2を受光して凹レンズ8に導き、凹レンズ8は、このレ ーザービームL2を平行光線に変換して偏向ビームスプ リッタ7に射出する。偏向ビームスプリッタ7は、この レーザーピームL2の偏波面がレーザーピームL1の偏 波面に対して90度の角度に保持されることにより、こ のレーザーピームL2を透過してピームスプリッタ11 に射出する。

【0031】このビームスプリッタ11は、このレーザ ーピームL2の一部を透過して凸レンズ12に射出し、 残りを反射して凸レンズ13に射出する。この凸レンズ 13は、このレーザービームL2を位置検出素子でなる 受光素子14に射出し、光空間伝送装置1では、この受 光素子14の出力信号S2に基づいて鏡筒5の向きを可 変し、レーザービーム L 1 を正しく伝送対象に向けて射

【0032】これに対して凸レンズ12は、レーザービ ームL2をアバランシェフォトダイオードでなる受光素 子15に集光する。信号処理回路26は、この受光素子 15の出力信号S3を電流電圧変換した後、所定利得で 増幅し、映像信号S4等を復調して出力する。これによ り光空間伝送装置1では、伝送対象から送出された映像 信号等を受信するようになされている。

【0033】このようにしてレーザーダイオード4を駆 動してレーザービームL1を送出するにつき、光空間伝 送装置1は、予めデータ入力装置20を介して入力され 30 化信号系の記載を省略して説明する。 たレーザーダイオード4等の特性データを基準にして、 光量モニタ回路21、電流モニタ回路22、温度モニタ 回路23のモニタ結果に基づいて、システム制御回路2 4でレーザーダイオード4の寿命を予測する。

【0034】すなわち光空間伝送装置1において、デー タ入力装置20は、光空間伝送装置1の操作パネルに配 置された操作子で形成され、この実施例では、最終調整 工程において、この操作子を操作することにより、シス テム制御回路24の動作モードを初期設定モードに切り に設定されると、操作子の操作に応動して順次入力され るレーザーダイオード4の特性データと光量モニタ回路 21の特性データとをメモリ回路26に記録する。

【0035】ここでこのメモリ回路26は、電気的に書 換え可能な読み出し専用メモリ(すなわちEEPROM でなる)で形成され、この実施例では、レーザーダイオ ード4の特性データとして、レーザーダイオード4の初 期設定光量L0、温度25度における初期発振開始電流 値Ithoo、初期発振開始電流Ithooの温度係数Cithoo

、温度25度における初期微分効率 n D00、初期微分

効率 n D00の温度係数 C n D0 及び標準的な劣化率 d c をメモリ回路26に記録する。

【0036】さらにメモリ回路26は、光量モニタ回路 21の特性データとして、レーザーダイオード4のパッ ケージに収納された光量モニタ用フォトディテクタにつ いて、レーザーダイオード4を初期設定光量し0で駆動 した際に得られる温度25度におけるこのフォトディテ クタのモニタ電圧値Vpd、モニタ電圧Vpdの温度係数C pdを記録する。なお劣化率以外の特性データは、レーザ 10 ーダイオード4毎に実測してメモリ回路26に記録さ れ、これにより光空間伝送装置1では、素子間で特性が ばらついた場合でも、正確にレーザーダイオード4の寿 命を予測する。

【0037】これに対して実際の使用時、システム制御 回路24は、光量モニタ回路21、電流モニタ回路22 及び温度モニタ回路23のモニタ結果に基づいて、レー ザーダイオード4から射出されるレーザービームし1の 光量が、この特性データの1つでなる初期設定光量L0 になるようにレーザーダイオード4を駆動する。

20 【0038】すなわちシステム制御回路24は、ディジ タルアナログ変換回路 (D/A) 28に駆動データを出 力し、このディジタルアナログ変換回路28は、この駆 動データをアナログ信号に変換して出力することによ り、図3に示すように、自動光量制御回路29にレーザ ーダイオード駆動用の基準電圧V1を出力する。なおこ の実施例では、この基準電圧V1で決まる光量を基準に して周波数多重化信号の信号レベルに追従してレーザー ビームし1の光量が変化するようにレーザーダイオード 4を駆動しているが、図3においては、この周波数多重

【0039】自動光量制御回路29は、抵抗30、可変 抵抗31及び抵抗32の直列回路の一端を負側電源ーV CCに接続し、この直列回路の他端に基準電圧V1を入 力する。さらに自動光量制御回路29は、可変抵抗31 の出力電圧を演算増幅回路33の非反転入力端に入力 し、この演算増幅回路33の出力信号を抵抗34を介し て駆動回路3に出力する。

【0040】駆動回路3は、コレクタを接地したトラン ジスタ35に、この演算増幅回路33の出力信号を受 換える。システム制御回路24は、この初期設定モード 40 け、このトランジスタ35によりレーザーダイオード4 を駆動する。すなわちトランジスタ35は、レーザーダ イオード4及び抵抗36の直列回路を介してエミッタを 負側電源-VCCに接続し、これにより基準電圧V1で 決まる光量を基準にしてレーザーダイオード4を駆動す

> 【0041】これに対して光量モニタ回路21は、この レーザーダイオード4のパッケージに一体に収納され て、レーザーダイオード4のリア側レーザービームを受 光するフォトディテクタ37を用いて、レーザーピーム 50 L1の光量を検出し、この光量検出結果を自動光量制御

10 hている。

回路29及びシステム制御回路24に出力する。

【0042】すなわち光量モニタ回路21は、抵抗39及び40の直列回路により負側電源を分圧し、その結果得られる分圧電圧を抵抗41を介してフォトディテクタ37を駆動する。なお抵抗39には、バイパスコンデンサ42が並列に接続されるようになされている。さらに光量モニタ回路21は、抵抗44を介して抵抗39及び40の接続中点を演算増幅回路45の非反転入力端に接続し、これによりレーザービームL1の受光結果でなるフォトディテクタ37の動作電流を演算増幅回路45で電流電圧変換する。

【0043】光量モニタ回路21は、このモニタ結果でなるモニタ電圧V2をアナログディジタル変換回路(A/D)46を介してシステム制御回路24に出力し、これによりシステム制御回路24では、メモリ回路26に格納した特性データに基づいてこのモニタ電圧V2からレーザービームL1の正しい光量を検出することができる。

【0044】これに対して自動光量制御回路29は、抵 20 抗47を介してこのモニタ電圧V2を演算増幅回路33 の反転入力端に帰還する。さらに演算増幅回路33は、出力端及び反転入力端に帰還抵抗48及び帰還コンデンサ49を接続し、これによりモニタ電圧V2に基づいて、レーザービームL1の光量が基準電圧V1で決まる光量を基準にして、周波数多重化信号の信号レベルに追従して変化するように、レーザーダイオード4の光量を制御する。

【0045】かくするにつきシステム制御回路24は、このレーザービームL1の光量がメモリ回路26に記録 30 した初期設定光量L0 になるように、駆動データを出力することになる。

【0046】これに対して電流モニタ回路22は、抵抗36及びレーザーダイオード4の接続中点にインダクター50を接続し、このインダクター50の他端を演算増幅回路51の非反転入力端に入力し、これによりレーザーダイオード4の動作電流から高周波成分を抑圧して演

I tho 
$$(T) = I \text{ thoo} + CI \text{ tho} \times (T - T0)$$

で表すことができる。ここでCIthoは、初期発振開始電流の温度係数を表し、Ithooは、温度25度における初 40 期発振開始電流を表し、何れもメモリ回路26に記録された特性データである。またT0 は、温度25度を表す。

【0051】なお図4は、このレーザーダイオード4の 初期動作特性を示し、温度25度の場合に比して温度5

 $\eta D0 \quad (T) = \eta D00 + C \eta D0 \times (T - T0)$ 

で表すことができる。

【0052】これによりレーザーダイオード4が何ら劣化していない場合、メモリ回路26に記録した初期設定 光量L0でレーザービームL1を射出するためには、 算増幅回路51に入力する。ここでこの演算増幅回路51は、反転入力端及び出力端を帰還抵抗53及びコンデンサ54で接続し、これによりレーザーダイオード4の動作電流を電流電圧変換し、変換結果でなるモニタ電圧 V3を生成する。電流モニタ回路22は、このモニタ電 圧V3をアナログディジタル変換回路(A/D)55を介してシステム制御回路24に出力し、これにより光空間伝送装置1では、システム制御回路24において、レーザーダイオードの動作電流をモニタできるようになさ

【0047】これに対して温度モニタ回路23は、サーミスタ等の感熱素子をレーザーダイオード4のパッケージに熱的に結合して保持し、この感熱素子で検出したレーザーダイオード4のパッケージ温度をアナログディジタル変換回路(A/D)56を介してシステム制御回路24に出力する。

【0048】このようにしてシステム制御回路24は、レーザーダイオード4を駆動し、このとき一定周期で図1に示す処理手順を実行し、これによりレーザーダイオード4の寿命を予測する。すなわちシステム制御回路24は、上述の条件で駆動を開始すると、ステップSP1からステップSP2に移り、ここでレーザーダイオード(LD)4の動作電流の異常を検出する。

【0049】ここでこのレーザーダイオード4の動作電流の異常は、電流モニタ回路22で検出されるレーザーダイオード4の動作電流を、温度モニタ回路23で検出される温度検出結果で補正した後、メモリ回路26に記録した劣化率を基準にして、判断される。すなわちレーザーダイオード4においては、温度が上昇すると、また長時間使用すると、同一光量のレーザービームL1を射出するために当初より多くの駆動電流が必要になる。

【0050】すなわちレーザーダイオード4においては、図4に示すように、LED発光からレーザーダイオード発光に切り換わる発振開始電流のうち、温度Tにおける初期発振開始電流値 I tho (T) は、次式

## 【数1】

#### ..... (1)

0度の方が発振開始電流が高く、また同一光量のレーザービームを射出するためには、多くの動作電流を要することがわかる。これに対して温度Tにおける初期微分効率 n D 0 (T) は、メモリ回路 2 6 に記録された温度 2 5 度における初期微分効率 n D 0 を微分効率温度係数 C n D 0 で補正して、次式

# 【数2】 T0) ······(2)

(1)式で表される初期発振開始電流値 I tho (T)から微分効率で決まる分だけ駆動電流を増加すればよいことがわかる。すなわち未使用のレーザーダイオード4に 50 おいて、光量LO のレーザービームL1を温度T度で射

9

出するためには、次式

I opo (T) = I tho (T) + 
$$\frac{L0}{7D0}$$
 (T) ..... (3)

10

で表される駆動電流 I opo (T) でレーザーダイオード を駆動すればよい。

【0053】これによりシステム制御回路24は、メモリ回路26に格納した特性データと温度モニタ回路23のモニタ結果により(1)~(3)式の演算処理を実行し、現在温度における初期状態の駆動電流 I opo (T)

di(T) = Iop - Iopo(T)

の演算処理を実行し、これにより劣化の程度 d i を検出する。

【0054】ここでこの劣化の程度 diは、レーザーダイオード4の使用時間に応じて変化する時間関数で表さ

$$dc (T, H) = \frac{di (T)}{H}$$

の演算処理を実行し、劣化率dc(T, H)を検出する。ここでHは、タイマ66によって検出されるレーザーダイオード4の動作時間であり、この実施例では、レーザーダイオード4を駆動している期間の間、このタイマ66を駆動することにより、レーザーダイオード4の延べ使用時間を確認できるようになされている。

【0055】さらにシステム制御回路24は、(5)式の演算処理によって検出された劣化率dc(T, H)とメモリ回路26に予め記録した劣化率との間で比較結果を得、メモリ回路26に記録した劣化率に比して劣化率dc(T, H)が著しく大きな値のとき、レーザーダイオード4の動作電流の異常と判断する。

【0056】このようにして異常と判断すると、システム制御回路24は、ステップSP3に移り、この検出した劣化率dc(T, H)を表示装置62に表示する。ここで表示装置62は、光空間伝送装置1の操作パネルに隣接して配置されるようになされている。これにより光空間伝送装置1は、オペレータに注意を促すようになされている。

【0057】さらにシステム制御回路24は、このステップSP3において、レーザーダイオード4の動作を停止制御した後、ステップSP4に移ってこの処理手順を終了する。これにより光空間伝送装置1は、レーザーダイオード4の動作を常時監視し、異常動作が発生するとレーザーダイオード4の動作を即座に停止制御し、レーザーダイオード4の破損等の事故を有効に回避するようになされている。

I op limit 
$$(T) = Climit \times I$$
 opo  $(T)$ 

の演算処理を実行して設定される。ここでClimit は、レーザーダイオードの動作限界電流係数を表し、一般に値1.2~1.5の範囲に選定される。

を検出する。さらにシステム制御回路24は、このようにして検出した駆動電流Iopo (T)と、電流モニタ回路22のモニタ電圧V3によって検出される動作電流値Iopとにより、次式

10

#### 【数4】

..... (4)

れることになる。これによりシステム制御回路24は、 この変化の程度di(T)について、次式

【数5】

.... (5)

【0058】これに対してステップSP2において異常 20 と判断されなかった場合、システム制御回路24は、ステップSP5に移り、ここでタイマ66のカウント値を 検出することにより、前回の寿命判断時から1時間が経過したか否か判断する。ここで否定結果が得られると、システム制御回路24は、ステップSP2に戻るのに対し、前回の寿命判断時から1時間が経過した場合、肯定 結果が得られることにより、ステップSP6に移り、レーザーダイオード4の寿命を予測する。

【0059】ここでこの寿命の予測は、予め規定した特性にレーザーダイオード4が劣化するまでの時間で判断され、この規定の特性は、電流モニタ回路22のモニタ結果でなるレーザーダイオード4の動作電流によって判断される

【0060】すなわちシステム制御回路24は、始めに温度モニタ回路23のモニタ結果と、メモリ回路26に格納した特性データにより上述の(1)~(3)式の演算処理を実行し、これによりレーザーダイオード4の現在温度Tにおける初期の駆動電流Iopo(T)を検出する。さらにシステム制御回路24は、この初期の駆動電流Iopo(T)から限界動作電流Ioplimit(T)を検出し、この限界動作電流Ioplimit(T)を検出し、この限界動作電流Ioplimit(T)をレーザーダイオード4の寿命と判断する。

【0061】ここでこの限界動作電流 I op limit (T)は、次式

【数6】

..... (6)

【0062】このようにしてレーザーダイオード4の現在温度Tにおける限界動作電流 I oplimit (T) が設定 50 されると、システム制御回路24は、電流モニタ回路2

11

2のモニタ結果より実際のレーザーダイオード4の動作 電流 I opを検出し、次式

$$Li(T) = Iop limit(T) - Iop$$

の演算処理を実行する。これによりシステム制御回路2 4は、限界動作電流 I oplimit (T) までの動作電流の 余裕分しi (T) を検出する。ここでこの余裕分しi (T) は、レーザーダイオード4の動作電流が寿命に至 るまでの残り分を表してなることにより、電流に換算し

Lh (T, H) = CLh (H) 
$$\times \frac{L1}{ds}$$

の演算処理を実行し、これにより残り寿命を時間で表してなる残り寿命しh(T, H)を検出する。ここでCLh(H)は、補正係数でなり、使用するレーザーダイオードの種類に応じて異なる値でなり、ここでは予め設定した値を代入して(8)式の演算処理を実行する。

【0064】このようにして残り寿命しれ(T. H)が検出されると、システム制御回路24は、続いてステップSP7に移り、ここで残り寿命が50時間以内か否か判断し、ここで否定結果が得られると、ステップSP2に戻る。かくしてこの実施例では、動作の異常だけ常時モニタし、寿命については、1時間毎に検出することにより、システム制御回路24の負担を軽減するようになされている。

【0065】これに対して図5に示すように、長時間使用するとレーザーダイオード4が劣化し、初期設定光量L0のレーザービームを得るために多くの動作電流を要するようになり、ついにはレーザーダイオード4の動作電流が限界動作電流Ioplimitを越えるようになる。この場合、このような状態に至る前に、システム制御回路3024は、ステップSP7において肯定結果が得られることにより、ステップSP8に移り、表示装置62に表示データを出力して残り寿命を表示する。さらにこのときシステム制御回路24は、残り寿命が短くなると、この

$$Vpd(T) = Vpdo + Cpd \times (T - T0)$$

【0069】これにより初期設定光量L0と低減後の光量L01においては、次式

$$L01=L0 \times \frac{Vpd 1}{Vpd (T)}$$

の関係式で表される関係式が得られ、これによりモニタ 電圧 V pd 1 が得られるように、レーザーダイオード4を 駆動してレーザービームL1の光量を初期設定光量L0 から光量L01に低減することができる。これにより図6 に示すように、レーザーダイオード4の駆動電流を低減 することができ、その分レーザーダイオード4の寿命を 【数7】

..... (7)

た寿命を表すことになる。

【0063】これによりステップSP2において検出した変化率dc(T, H)を用いて、システム制御回路24は、次式

12

【数8】

表示を点滅表示に切り換え、さらに残り寿命が短くなる と、この点滅の周期を徐々に短くする。これによりシス テム制御回路24は、残り寿命に対応して残り寿命を表 示し、オペレータの注意を喚起する。

【0066】続いてシステム制御回路24は、ステップSP9に移り、延命の操作子が押圧操作されたか否か判断する。ここで光空間伝送装置1は、操作パネル上に延命の操作子63が配置され、システム制御回路24は、所定期間経過してもこの延命の操作子63が押圧操作されない場合、ステップSP2に戻るのに対し、ここで延命の操作子63が押圧操作されると、ステップSP10に移り、レーザービームL1の光量を低減する。

【0067】ここでシステム制御回路24は、光量モニタ回路21で検出されるモニタ電圧V3に基づいて、予め設定した範囲内で、予め設定した割合だけレーザービームL1の光量を低減する。すなわち光量モニタ用のフォトディテクタについて、初期設定光量L0における温度T度のモニタ電圧をVpd(T)とおき、このメモリ回路26に格納した初期設定光量L0における温度25度のモニタ電圧をVpdo、このモニタ電圧Vpdoの温度係数をCpdとおけば、次式の関係式を得ることができる。

[0068]

【数9】

..... (9)

【数10】

..... (10)

延ばすことができる。

【0070】さらにシステム制御回路24は、このようにして光量を低減すると、続いてこの低減した光量で寿命予測し、予測結果を表示する。ここでシステム制御回路24は、次式

【数11】

I opol (T) = I tho (T) + 
$$\frac{L01}{\eta D0}$$
 (T) ..... (11)

の初期動作電流 I opol (T) を検出する。

【0071】さらに電流モニタ回路22のモニタ電圧V 2によって規定されるレーザーダイオード4の動作電流 dil(T) = Iopi - Iopol(T)

の演算処理を実行し、現在温度における劣化の程度dil (T)を検出する。

【0072】さらにシステム制御回路24は、現在温度 Lil(T) = Iop limit(T) - Iopl

の演算処理を実行し、これにより電流換算の寿命Lil

(T)を検出する。さらにシステム制御回路24は、タ

$$dcl(T, H) = \frac{dil(T)}{H}$$

の演算処理を実行し、現在温度における光量L01の劣化 率dcl(T,H)を検出する。

【0073】これによりシステム制御回路24は、

Lh1 (T, H) = CLh (H) 
$$\times \frac{\text{Li1 (T)}}{\text{dcl (T, H)}}$$
 ..... (15)

の演算処理を実行し、残り寿命Lhl(T,H)を予測す る。

【0074】システム制御回路24は、この予測した寿 命を表示し、この表示に対応してオペレータが了解の操 作子を操作すると、ステツプSP2に移り、この低減し た光量で引き続いてレーザーダイオード4を駆動する。 これにより光空間伝送装置1では、この変更した駆動条 件でレーザーダイオード4を駆動してレーザーダイオー ド4の寿命を延長し、この状態で通信を継続することに なる。

又はダウンの操作子を操作すると、システム制御回路2 4は、この操作子の操作に対応して光量を増大し、また は低減し、改めて寿命予測すると共に、予測結果を表示 し、オペレータの操作を待ち受ける。

【0076】すなわちこの種の光空間伝送装置1を用い る中継現場においては、例えばニュースの中継現場のよ うに、比較的短時間の間、通信回線を確保したい場合が ある。この場合、例えば雨中のように、光空間伝送路の 伝送条件が極めて劣化する場合もある。このような場合 においては、レーザーダイオード4の寿命を延長するよ り、この短時間の間、映像信号を高品質で伝送すること が望まれる。

【0077】これに対して比較的長時間、映像信号を伝 送したい場合もあり、この場合はレーザービームL1の 光量を低減してでも、長時間、通信回線を確保すること が望まれる。このため光空間伝送装置1は、レーザーダ イオード4が寿命に近づくと、オペレータの注意を喚起 すると共に、オペレータの操作を待ち受けてレーザービ ームL1の光量を低減することにより、光空間伝送装置

Iopl から、次式 【数12】

..... (12)

における限界動作電流値 I op limit (T) から、次式 【数13】

14

..... (13)

イマ66のカウント結果を用いて、次式

10 【数14】

.... (14)

【数15】

(8) 式と同様に、次式

20 ド4の寿命を延長するようになされ、これにより使い勝 手を向上するようになされている。

【0078】またこのレーザービームし1の光量を低減 する際、光空間伝送装置1は、低減後の光量でレーザー ダイオード4の寿命を予測し、オペレータの了解を求め ることにより、オペレータにおいては、この再予測した 寿命と使用条件とに基づいて必要に応じて駆動条件を再 設定することができ、これによりさらに一段と光空間伝 送装置1の使い勝手を向上することができる。

【0079】以上の構成において、光空間伝送装置1 【0075】これに対してオペレータがアップの操作子 30 は、最終調整工程において、初期設定モードに設定さ れ、メモリ回路26に、レーザーダイオード4の特性デ ータとして、レーザーダイオード4の初期設定光量L0 、温度25度における初期発振開始電流値Ithoo、初 期発振開始電流 I thooの温度係数CIthoo 、温度25度 における初期微分効率 n D00、初期微分効率 n D00の温 度係数CnD0 及び標準的な劣化率dcが記録され、ま た光量モニタ回路21の特性データとして、レーザーダ イオード4を初期設定光量L0 で駆動した際に得られる 温度25度におけるモニタ電圧値Vpd、モニタ電圧Vpd 40 の温度係数 Cpdが記録される。

> 【0080】これに対して実際の使用時、光空間伝送装 置1は、システム制御回路24によって光量モニタ回路 21、電流モニタ回路22及び温度モニタ回路23のモ ニタ電圧がモニタされ、これによりレーザービームL1 の光量、レーザーダイオード4の駆動電流、レーザーダ イオード4のパッケージ温度がモニタされた状態でレー ザーダイオード4が駆動され、初期設定光量L0 のレー ザーピームし1がこのレーザーダイオード4が射出され る。

1の使用条件に対応して必要に応じてレーザーダイオー 50 【0081】このときこのレーザービームし1は、映像

信号により変調された状態でレーザーダイオード4から 射出され、大口径レンズ9から伝送対象に向かって送出 され、これにより伝送対象に映像信号が伝送される。

【0082】このようにしてレーザーダイオード4を駆動するにつき、光空間伝送装置1は、電流モニタ回路22で検出されるレーザーダイオード(LD)4の動作電流から劣化率 d c (T. H)が検出され、この劣化率 d c (T. H)とメモリ回路26に記録された劣化率との間で比較結果を得ることにより、レーザーダイオード4の動作電流の異常が監視される。ここで異常が検出され 10 ると、この劣化率 d c (T. H)が表示装置62に表示され、レーザーダイオード4の動作が停止制御され、これによりレーザーダイオード4の破損等が有効に回避される。

【0083】これに対して異常なくレーザーダイオード 4が動作している場合、光空間伝送装置1は、1時間毎 にレーザーダイオード4の寿命を予測し、残り寿命が5 0時間以内になると、表示装置62に表示データを出力 して残り寿命を表示する。さらにこのとき光空間伝送装置1は、残り寿命に対応して残り寿命の表示形態を切り 20 換え、オペレータの注意を喚起する。

【0084】この状態で所定期間内に延命の操作子が押圧操作されると、光空間伝送装置1は、レーザービームL1の光量を低減し、この低減した光量でレーザーダイオード4の寿命を再予測する。さらに再予測した寿命を表示してオペレータの了解を求め、ここでオペレータの操作に応動してこの低減した光量で、またこの低減した光量からさらに可変した光量で、レーザービームL1を射出する。

【0085】以上の構成によれば、レーザーダイオードの特性データを予めメモリ回路26に記録し、レーザーダイオードの動作状態とこの特性データとからレーザーダイオードの寿命を予測することにより、使用環境、素子間で寿命が大きく異なる場合でも、正しく寿命を予測することができる。これによりこの予測した寿命に基づいて、レーザービームの光量を低減してレーザーダイオードの寿命を延ばすことができる。また必要に応じてレーザーダイオードを交換して、また交換の手配をして、さらには使用環境を屋内等に制限して、この種の光空間伝送装置の使い勝手を向上することができる。

でも、レーザーダイオード4の特性データを予め記録することにより、使用環境、素子間で大きく異なる寿命を 正しく予測することができる。

16

【0087】さらに上述の実施例においては、専用の自動光量制御回路によりレーザービームの光量を規定値に保持する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、システム制御回路24により、併せて自動光量制御回路を形成してもよい。すなわちこの場合図8に示すように、光量モニタ回路21のモニタ結果V2をシステム制御回路24に出力し、ここでこのモニタ結果V2を温度特性で補正し、この補正値が一定値になるようにディジタルアナログ変換回路28に駆動データを出力することになる。

【0088】また上述の実施例においては、いわゆるリアモニタ方式によりレーザービームL1の光量をモニタする場合について述べたが、本発明はこれに限らず、いわゆるフロントモニタ方式によりレーザービームの光量をモニタする場合にも適用することができる。

【0089】さらに上述の実施例においては、双方向の 20 光空間伝送装置に適用して映像信号を伝送する場合つい て述べたが、本発明はこれに限らず、送信専用及び受信 専用の光空間伝送装置間で映像信号を伝送する場合、映 像信号に限らず種々の情報信号を伝送する場合、さらに は種々の光通信装置に広く適用することができる。

#### [0090]

【発明の効果】上述のように本発明によれば、使用条件、装置間で大きく変化するレーザーダイオードの寿命を正確に予測することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

② 【図1】本発明の一実施例による光空間伝送装置の動作の説明に供するフローチャートである。

【図2】図1の光空間伝送装置の全体構成を示すブロック図である。

【図3】図2のレーザーダイオードの周辺回路を示す接 続図である。

【図4】レーザーダイオードの初期状態における動作電流と光量との関係を示す特性曲線図である。

【図5】長時間使用した場合におけるレーザーダイオードの動作電流と光量との関係を示す特性曲線図である。

40 【図6】図5において光量を低減した場合における動作点の変化を示す特性曲線図である。

【図7】他の実施例による光空間伝送装置のレーザーダイオードの周辺回路を示す接続図である。

【図8】システム制御回路により光量を一定値に保持する実施例のレーザーダイオードの周辺回路を示す接続図である。

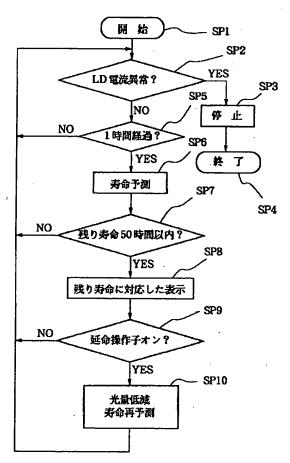
【図9】レーザーダイオードの平均寿命時間を示す特性 曲線図である。

【図10】微分効率と温度との関係を示す特性曲線図で

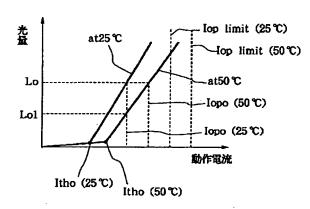
18

【図11】発振開始電流と温度との関係を示す特性曲線	3	駆動回路
図である。	4	レーザーダイオード
【図12】発振開始電流の個体間のばらつきを示す特性	2 0	データ入力装置
曲線図である。	2 1	光量モニタ回路
【図13】動作電流の個体間のばらつきを示す特性曲線	22	電流モニタ回路
図である。	2 3	温度モニタ回路
【図14】微分効率の個体間のばらつきを示す特性曲線	2 4	システム制御回路
図である。	2 6	メモリ回路
【図15】光量モニタ用フォトディテクタについて個体	2 8	ディジタルアナログ変換回路
間のばらつきを示す特性曲線図である。	10 29	自動光量制御回路
【図16】光量モニタ用フォトディテクタの温度特性を	46,55,56	アナログディジタル変換回路
示す特性曲線図である。	63	操作子
【符号の説明】	6 6	タイマ
1 光空間伝送装置		

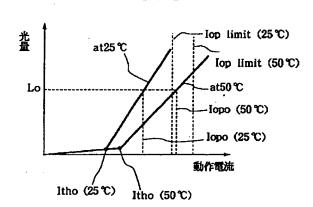
【図1】

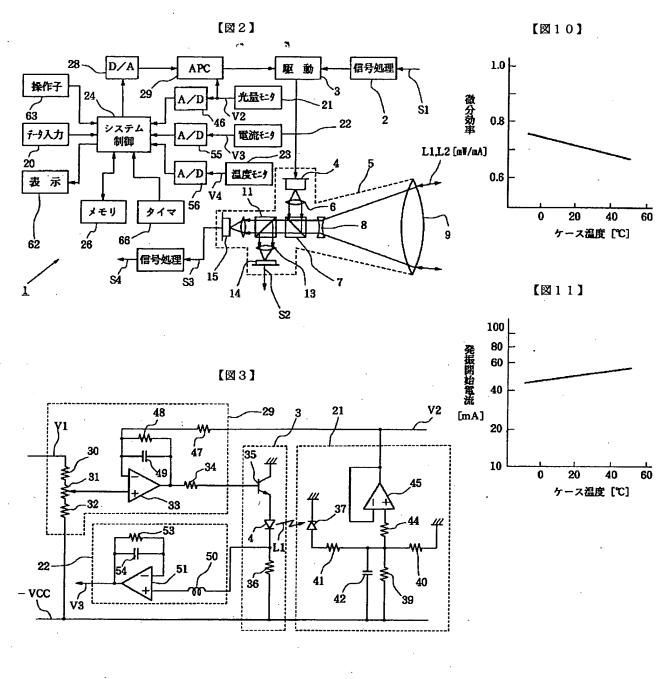


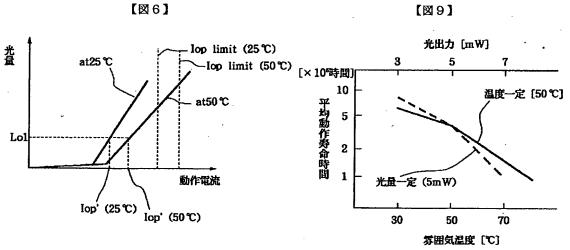
[図4]

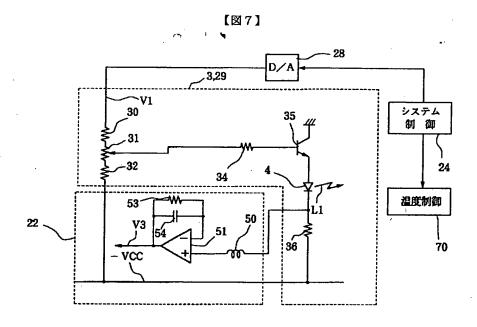


【図5】

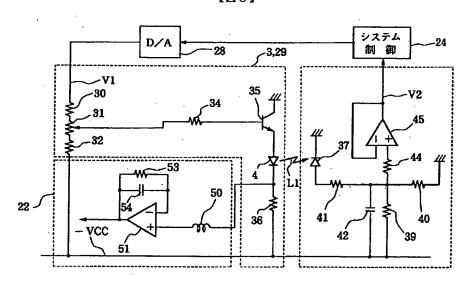




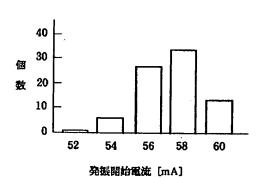




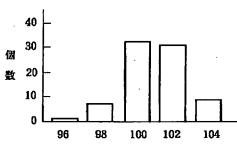
【図8】



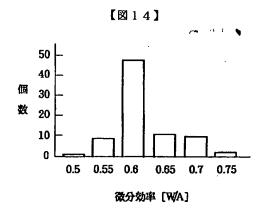
[図12]

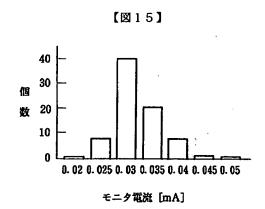


【図13】

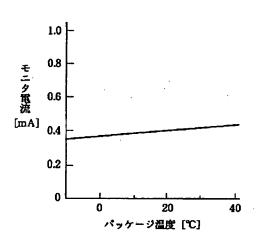


動作電流 [mA:Po=30mW]









# フロントページの続き

(51) Int. Cl. <sup>6</sup>	
H 0 4 B	10/14
	10/06
	10/04
	10/08

識別記号 庁内整理番号

FI

技術表示箇所

H 0 4 B 9/00

K